

資料番号：A-3-8201PF

作成日：平成23年7月5日

TED オリジナル(inrevium) 製品信頼性試験データ

1. 対象製品 TE8201PF

2. 信頼性試験

項目	条件	試験数量	試験時間	不良数量	判定基準
温度サイクル	-65℃～150℃ every 30 minutes	22 *1	100cyc	0	電 気 的 特 性 が 製 品 規 格 内 を 良 品 と す る
フ レ ッ シ ャ ー ク ッ カ ー	Ta=121℃, 100%RH 0.203Mpa	22 *1	100h	0	
高温高湿保存	Ta=85℃ 85%RH	22 *1	1000h	0	
高温保存	Ta=150℃	22	1,000h	0	
低温保存	Ta=-65℃	22	1,000h	0	
高温動作	Ta=125℃ VDD=operation MAX	22	1,000h	0	
高温高湿バイアス	Ta=85℃ 85%RH VDD=operation MAX	22 *1	1,000h	0	
静電破壊	対 Vdd, 対 Gnd と各 PIN の組み合わせ C=200pF, R=0Ω, ±200V	12	1 回	0	

*1 前処理として、赤外線リフロー(255℃ 10sec)による半田耐熱性試験を実施

4. 備考

本資料の内容は、対象製品と同一プロセスにて製造した同一ダイサイズの代表品による試験結果です。